



PROGRAMA DEL CURSO

Título del curso: Fundamentos de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microanálisis. Ref. 17.109

Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis de Materiales

Horario: 09:00 a 17:30 horas

UNIDAD DIDÁCTICA / PRÁCTICA	HORAS	FECHA	DOCENTE	AULA / LABORATORIO
Presentación del Curso y del Servicio de Microscopía Electrónica y Microanálisis de Materiales	0,5	03/04/2017	Ana Martínez	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Introducción	0,5	03/04/2017	Ana Martínez	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Fundamentos del MEB	1	03/04/2017	Ana Martínez	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Interacción de electrones con la materia y modos de imagen	0,75	03/04/2017	Ana Martínez	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Imagen en MEB.	0,75	03/04/2017	Sergio Fernández	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Difracción de electrones en MEB: EBSD	0,5	04/04/2017	Sergio Fernández	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Microanálisis en MEB: EDX y WDX.	1	04/04/2017	Sergio Fernández	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Muestras: Tipo y preparación.	1	04/04/2017	Sergio Fernández	Aula por confirmar, Facultad de Ciencia y Tecnología
Visita a equipos de preparación de muestra	1	04/04/2017	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.13 y CD4.S1.12), Facultad de Ciencia y Tecnología
Descripción de partes del equipo (MEB)	0,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD3.S1.9), Facultad de Ciencia y Tecnología
Alineamiento e imagen básica en electrones secundarios (MEB)	2	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD3.S1.9), Facultad de Ciencia y Tecnología



Imagen en electrones retrodispersados y EDX	1,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD3.S1.9), Facultad de Ciencia y Tecnología
Microanálisis cuantitativo	2	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD3.S1.9), Facultad de Ciencia y Tecnología
Descripción de partes del equipo (FEG)	0,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.11), Facultad de Ciencia y Tecnología
Alineamiento y efectos en Imagen (FEG)	1,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.11), Facultad de Ciencia y Tecnología
Imagen en electrones retrodispersados y EDX (FEG)	1,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.11), Facultad de Ciencia y Tecnología
Imagen de muestras aislantes a bajo voltaje	1,5	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.11), Facultad de Ciencia y Tecnología
EBSD	2	05 y 06/04/2017*	Ana Martínez y Sergio Fernández	Laboratorios SGIker (CD4.S1.11), Facultad de Ciencia y Tecnología

*Las clases serán de mañana y tarde.